

蛍光寿命システム 蛍光スペクトル測定システム



特長

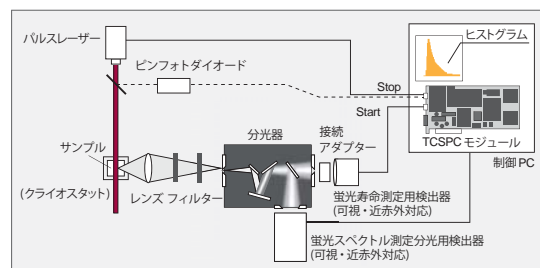
- TCSPCモジュールを採用し、100 psの高時間分解能で蛍光寿命測定が可能
- 高繰返しのピコ秒ダイオードレーザー採用で、短時間でデータ収集が可能
- 波長可変光源を使用することで、400~1100 nmまでの励起波長を簡単切替
- 分光器に蛍光寿命用検出器、蛍光スペクトル用検出器を同時搭載
- 顕微鏡ベースでシステム構築可能
- サンプルホルダーにクライオスタット搭載可能

用途

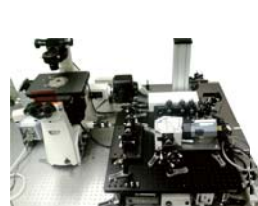
- ピコ秒時間分解蛍光寿命測定
- 蛍光スペクトルPL測定
- 蛍光スペクトルPLE測定
- 強度相関測定 (ハンチング・アンチハンチング)
- 蛍光寿命イメージング測定
- ラマン分光・イメージ測定

蛍光寿命・蛍光スペクトル測定システム構成例

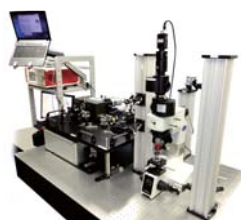
高繰返しパルスレーザー、高感度検出器(蛍光寿命・スペクトル測定用)、TCSPCモジュール、分光器、制御用PC、ソフトウェアを組み合わせた特注システムです。



特注システム構成例



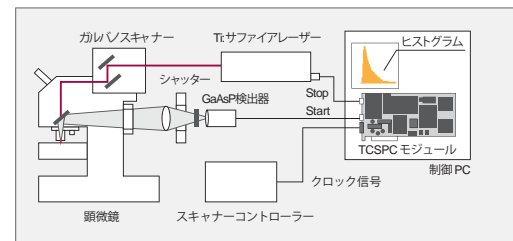
顕微分光光学系



波長可変顕微分光システム

蛍光寿命イメージング測定システム構成例

共焦点レーザー顕微鏡に高繰返しパルスレーザー、ハイブリットGaAsP検出器、TCSPCモジュールを組み合わせたイメージングシステムです。ガルバノスキャナーの他に、ピエゾステージでのマッピングも可能です。



マクロ分光光学系
(クライオスタット込み)



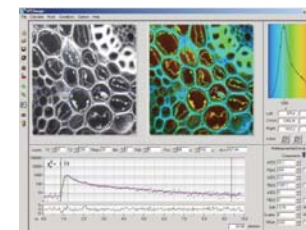
顕微ラマン分光システム

ピコ秒パルスレーザー、高感度検出器、分光器、計測器、
その他光学系も含めたシステムとしてご提案させていただきます。ご相談ください。

制御用ソフトウェア

蛍光寿命測定用ソフトウェア SPCM/SPC-Image

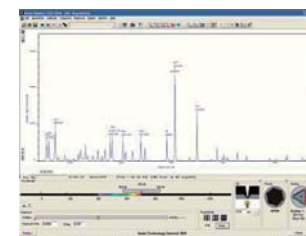
TCSPCモジュールの調整・制御
蛍光減衰曲線、蛍光寿命イメージのデータ収集
蛍光減衰曲線、蛍光寿命イメージの解析
(3成分までのデコンボリューション、フィッティング解析)



蛍光スペクトル測定用ソフトウェア

AndorSolis

CCD検出器、分光器の調整・制御
蛍光スペクトルのデータ収集



当社オリジナルデータ収集用ソフトウェア

Nanofinder®

TCSPCモジュール、CCD検出器、分光器の調整・制御
蛍光減衰曲線、蛍光寿命イメージ、蛍光スペクトル、
ラマンスペクトル、ラマンイメージのデータ収集

